

SCAN TECH 2024

柔剛ともによく制す

～達人に聞く！試料前処理と観察技術の最前線～

日時：2024年 8月30日（金）10:00～18:30

場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

開会挨拶（10:00～10:10）

豊岡 公德（理化学研究所）

基礎講座（10:10～11:40）

1. SEM像で何が見えるのか？検出器毎のアクセプタンスの理解と像解釈

小田 武秀（カールツァイス）

2. 現代SEM分析道の心得

三井 千珠（オックスフォードインストゥルメンツ）

3. 高分子材料の試料調製 - トレース（模倣）のための必要条件

丹羽 博嗣（三菱ケミカル）

ポスター・企業展示&休憩（11:40～13:00）

トピックス（13:00～13:30）

4. 根圏電顕イメージング：柔剛生物試料を観る断面研磨SEM法の開発

豊岡 公德（理化学研究所）

応用講座1（13:30～14:50）

5. EPMAを用いた高分解能軟X線発光分光測定による

原子力・核融合炉材料中の軽元素化学状態分布分析

笠田 竜太（東北大学）

6. in-situ 充放電SEM観察・分析技術

～全固体電池Si負極における充放電過程の解析～

山本 康晶（日本電子）

ポスター・企業展示&休憩（14:50～15:30）

応用講座2（15:30～16:50）

7. 走査電子誘電率顕微鏡による溶液中の生物試料やナノ粒子の直接観察と分析

小椋 俊彦（産業技術総合研究所）

8. FIB-SEM シリアルセクションング - 観察・解析技術の現状と課題 -

原 徹（物質・材料研究機構）

閉会挨拶

横江 大作（JFCC）

ポスター&企業展示、フリートーキング（～18:30）